Japan Calibration
Service System

JCSS
技術的要求事項適用指針

登録に係る区分: 音響・超音波
校正手法の区分の呼称: 音響測定器等
計量器等の種類: 計測用マイクロホン、
サウンドレベルメータ、
音響校正器

第10版
(JCT21500-10)

改正:2026年4月1日

独立行政法人製品評価技術基盤機構
適合性評価推進センター 認定センター

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

目次

序文 3
1. 適用範囲 3
2. 引用規格及び関連文書 3
2.1 引用規格 3
2.2 関連文書 4
3. 用語 4
4. 参照標準 5
4.1 特定標準器による特定二次標準器の校正 5
4.2 特定二次標準器による常用参照標準の校正 5
4.3 特定二次標準器、常用参照標準又はワーキングスタンダードによる校正 5
4.4 参照標準の校正周期 6
4.5 参照標準の具備条件 6
5. 設備 7
6. 測定のトレーサビリティと校正用機器 7
6.1 ワーキングスタンダード 7
6.2 校正用機器 7
7. 施設及び環境条件 7
7.1 施設 7
7.2 環境条件 7
8. 校正方法及び方法の妥当性確認 7
8.1 校正方法 7
8.2 妥当性の確認 8
8.3 規格外の方法 8
9. 校正測定能力及び測定の不確かさ 8
9.1 校正測定能力 8
9.2 測定の不確かさ 8
10. サンプリング 8
11. 校正品目の取り扱い 9
12. 結果の報告(校正証明書) 9
13. 要員 9
13.1 技術に係る管理要員(代理人を含む) 9
13.2 校正従事者に対する資格、経験及び教育・訓練 9
14. サービス及び供給品の購買 10
15. 登録申請書の記載事項 10
16. その他 10
別添1 登録申請書の記載例 11
別添2 校正用機器のトレーサビリティ事例 14

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

JCSS 技術的要求事項適用指針
登録に係る区分:音響・超音波
校正手法の区分の呼称:音響測定器等
計量器等の種類:計測用マイクロホン、サウンドレベルメータ、音響校正器

序文

この技術的要求事項適用指針(以下「適用指針」という。)は、JCSSにおいて登録の要件として用いるISO/IEC 17025(JIS Q 17025)に規定されている技術的要求事項の明確化及び解釈を次の適用範囲について示すことを目的としている。

1. 適用範囲

この適用指針は、JCSSにおける登録に係る区分「音響・超音波」のうち、校正手法の区分の呼称「音響測定器等」について定める。

2. 引用規格及び関連文書

2. 1 引用規格

ISO/IEC 17025(JIS Q 17025) 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項

ISO/IEC Guide 99 International vocabulary of metrology – Basic and general concepts and associated terms (VIM)(国際計量計測用語－基本及び一般概念並びに関連用語(VIM))

ISO/IEC Guide 98-3 Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM)
(計測における不確かさの表現のガイド(GUM))

JIS Z 8103 計測用語

JIS Z 8106:2000 音響用語 [IEC 60050-801:1994 (IDT)]

IEC 61094-1:2000 Measurement microphones- Part 1: Specifications for laboratory standard microphones (計測用マイクロホン－第1部:標準マイクロホンの仕様)

IEC 61094-2:2009 Measurement microphones- Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique (計測用マイクロホン－第2部:標準マイクロホンの相互校正法による音圧校正)

IEC 61094-2:2009/AMD1:2022 Measurement microphones- Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique (計測用マイクロホン－第2部:標準マイクロホンの相互校正法による音圧校正/追補1)

IEC 61094-4:1995 Measurement microphones- Part 4: Specifications for working standard microphones (計測用マイクロホン－第4部:ワーキングスタンダードマイクロホンの仕様)

IEC 61094-5:2016 Measurement microphones- Part 5: Methods for pressure calibration of working standard microphones by comparison (計測用マイクロホン－第5部:比較法によるワーキングスタンダードマイクロホンの音圧校正)

IEC 61094-6:2004 Measurement microphones – Part 6: Electrostatic actuators for determination of frequency response (計測用マイクロホン－第6部 : 周波数レスポンスの測定のための静電アクチュエータ)

IEC TS 61094-7:2006 Measurement microphones- Part 7: Values for the difference between free-field and pressure sensitivity levels of laboratory standard microphones (計測用

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

マイクロホンー第7部 標準マイクロホンの音圧感度レベルと自由音場感度レベルの差の値)

IEC 61094-8:2012 Measurement microphones - Part 8: Methods for determining the free-field sensitivity of working standard microphones by comparison (計測用マイクロホンー第8部:比較法によるワーキングスタンダードマイクロホンの自由音場感度の測定方法)

IEC 62585:2012 Electroacoustics - Methods to determine corrections to obtain the free-field response of a sound level meter (電気音響ーサウンドレベルメータの自由音場レスポンスを得るための補正値を求める方法)

JIS C 1509-1:2017 電気音響ーサウンドレベルメータ(騒音計)ー第1部:仕様 [IEC 61672-1:2013 (IDT)]

JIS C 1509-2:2018 電気音響ーサウンドレベルメータ(騒音計)ー第2部:型式評価試験[IEC 61672-2:2013 (IDT)]

JIS C 1509-3:2019 電気音響ーサウンドレベルメータ(騒音計)ー第3部:定期試験 [IEC 61672-3:2013 (IDT)]

JIS C 1515:2020 音響校正器 [IEC 60942:2017 (IDT)]

ISO 266:1997 Acoustics - Preferred frequencies for measurements (音響—測定のための推 奨周波数)

2．2 関連文書

JCSS登録及び認定の一般要求事項(JCRP21)

IAJapan計量トレーサビリティに関する方針(URP23)

3．用語

3．1 この適用指針の用語は、ISO/IEC 17025(JIS Q 17025)、VIM、JIS Z 8103及びJIS Z 8106の該当する定義を適用する他、引用規格における用語の定義を適用する。

3．2 この技術的適用指針では以下の定義を適用する。

特定二次標準器:特定標準器により校正された標準マイクロホンであって、校正事業者の保有する参照標準

常用参照標準:特定二次標準器に連鎖して校正された標準マイクロホンであって、特定二次標準を保有しない校正事業者の参照標準

ワーキングスタンダード:特定二次標準器又は常用参照標準によって校正された計測用マイクロホン、サウンドレベルメータ又は音響校正器

標準マイクロホン:IEC 61094-1で規定されたコンデンサマイクロホン(以下、Type LS1PをⅠ形標準マイクロホン、Type LS2aP/LS2F及びLS2bPをⅡ形標準マイクロホンという。)

計測用マイクロホン:IEC 61094-4の規定に準拠した形状・寸法のコンデンサマイクロホン、並びに標準マイクロホン

サウンドレベルメータ:JIS C 1509-1で規定されたサウンドレベルメータ(騒音計)

音響校正器:JIS C 1515で規定された音響校正器(サウンドキャリブレータ)

校正用機器:特定二次標準器、常用参照標準及びワーキングスタンダード以外の機器等であって、校正に使用するもの

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

自由音場レスポンスレベル: マイクロホンに基準方向で入射する平面進行波によるサウンドレベルメータの指示値と、サウンドレベルメータがないときの周波数重み付けした音圧レベルとの差。周波数重み付け特性を指定する。

基準負荷容積:音響校正器の仕様又は取扱説明書で規定されたマイクロホン実効負荷容積

(注) 特定二次標準器、常用参照標準並びにワーキングスタンダードとして用いる標準マイクロホンをまとめて「参照標準等」と記す。

4. 参照標準

4. 1 特定標準器による特定二次標準器の校正

1) 校正対象

校正対象機器は標準マイクロホン、校正量は音圧感度レベルとする。

2) 校正範囲

Ⅰ形標準マイクロホンについては20 Hz以上12.5 kHz以下、Ⅱ形標準マイクロホンについては20 Hz以上20 kHz以下の周波数とする。

校正周波数は、原則としてISO 266に規定された1/3オクターブ系列とするが、必要に応じて他の系列の周波数を用いてもよい。また電源周波数の影響を避けるため系列の数から約±5 %以内でずらした周波数を用いてもよい。

4. 2 特定二次標準器による常用参照標準の校正

1) 校正対象

校正対象機器は標準マイクロホン、校正量は音圧感度レベルとする。

2) 校正範囲

校正周波数は、4. 1　2)に準じる。

3) 校正方法

以下のいずれかの方法を用いて、音圧感度レベルを求める。

① IEC 61094-2 に準拠したカプラを用いた相互校正法

② IEC 61094-5 に準拠した比較校正法

4. 3 特定二次標準器、常用参照標準又はワーキングスタンダードによる校正

1) 校正対象

校正対象機器は、計測用マイクロホン、サウンドレベルメータ並びに音響校正器とする。

2) 校正範囲

参照標準による校正の範囲は、20 Hz以上20 kHz以下の周波数とする。ただし、Ⅰ形マイクロホンを参照標準として用いる場合には20 Hz以上12.5 kHz以下の周波数、ワーキングスタンダードを介して校正を行う場合には、ワーキングスタンダードの動作周波数範囲とする。校正周波数は、4. 1 2)に準ずる。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

登録事業における校正では、次の要求事項が適用される。

① 校正量は、以下のとおりとする。

表1 校正対象機器と校正量

校正対象機器	校正量
計測用マイクロホン	音圧感度レベル
	自由音場感度レベル
サウンドレベルメータ	自由音場レスポンスレベル
音響校正器	音圧レベル

② 本適用指針による校正は、参照標準が校正された周波数を超えない範囲とする。

③ 参照標準が校正された周波数範囲内であって、校正を受けた周波数以外の内挿による校正を行う場合は、内挿の方法を文書化し不確かさの見積りを行うこと。

④ 標準マイクロホン(IEC 61094-1規定のLS1P及びLS2aP)の音圧感度レベルから自由音場感度レベルを算出する場合には, IEC TS 61094-7に記載された標準マイクロホンの自由音場補正量を用い、校正結果の不確かさには自由音場補正量の不確かさを含むこと。

⑤ 音響校正器、IEC 61094-2又はIEC 61094-5に準拠した方法により求めた計測用マイクロホンの音圧感度レベルに補正量(製造メーカ等提供値も含む)を加えて自由音場感度レベルを求める場合には、校正結果の不確かさに補正量の不確かさを含むこと。

⑥ 静電アクチュエータで求めた計測用マイクロホンの周波数レスポンスの基準周波数に対する相対値に、当該基準周波数における計測用マイクロホンの音圧感度レベル、ならびに補正量(製造メーカ等提供値も含む)を加えて音圧感度レベルまたは自由音場感度レベルを求める場合には、校正結果の不確かさに補正量の不確かさを含むこと。

⑦ サウンドレベルメータの自由音場レスポンスレベルの算出においてIEC 62585による補正量(製造メーカ等提供値も含む)を用いる場合は、校正結果の不確かさには補正量の不確かさを含むこと。

⑧ 音響校正器の音圧レベルは、多くの場合音響校正器に装着するマイクロホンの実効負荷容積に依存する。このため音響校正器の音圧レベルを参照標準等装着時の値から基準負荷容積付加時の値へ補正する場合には、校正結果の不確かさに補正量の不確かさを含むことが望ましい。補正量の不確かさ評価を行っていない場合には、参照標準等の実効負荷容積並びに音響校正器のカプラ容積の公称値を用いて音圧レベルを換算することになるため、補正量を校正証明書に明記することでトレーサビリティを確保すること。

また特定の型式のマイクロホンを装着した時に発生する音圧レベルへ補正する場合についても、これに準ずる。

4．4 参照標準の校正周期

校正の有効期間は、校正実施日の翌月の一日から起算して、2年とする。

ただし、校正事業者が参照標準について定期的な検証を行う中で異常等が検出された場合は、上記、校正の有効期間内であっても特定標準器又は特定二次標準器による校正を受けなければならない。

4．5 参照標準の具備条件

1) 管理用の標準マイクロホンを具備し、これを用いて精度管理する手順を定める。又は、これに代る手順によって精度管理を行うこと。参照標準の感度レベルの経歴を記録しておくことが望ましい。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

2) IEC 61094-2の取扱注意事項に従うこと。

5. 設備

1) 増幅器、減衰器、信号発生器、フィルタ、電圧計(FFTアナライザ等、電圧読み取りのための機器を含む)などのエレクトロニクス機器は、十分安定で、不確かさの評価可能なものを用いること。
2) カプラは、IEC 61094-2又はIEC 61094-5に規定された構造のものを用いること。
3) 無響室、無響箱を用いるときは、逆二乗特性等によって、使用する周波数において自由音場としての十分な性能を有することを評価確認すること。

6. 測定のトレーサビリティと校正用機器

6. 1 ワーキングスタンダード

1) ワーキングスタンダードを用いて校正事業を行う場合は、校正手順書等に参照標準によるワーキングスタンダードの校正の手順、不確かさの算出、校正周期等を含む管理方法を文書化し、ワーキングスタンダードを適切に管理しなければならない。
2) ワーキングスタンダードの具備条件
対応するJIS又はIEC規格の規定を満足するものを用いること。
3) ワーキングスタンダードの校正周期は、参照標準の校正周期を超えない範囲で設定すること。

6. 2 校正用機器

校正結果の不確かさ又は有効性に重大な影響を持つ校正用機器は、「IAJapan計量トレーサビリティに関する方針」(URP23)に定める方針に従うこと。事例を別添2に示す。

(注) 室内環境測定器であって不確かさに重大な影響を与える場合も「IAJapan計量トレーサビリティに関する方針」に従うこと。

7. 施設及び環境条件

7. 1 施設

恒久的な施設であることが望ましい。移動校正又は出張校正等で恒久的な施設以外の場所で校正を実施する場合は、7. 2を参考にして環境条件について文書化すること。

7. 2 環境条件

1) 校正室の温度
校正室の温度は、23 ℃ ±1 ℃を維持することが望ましい。
2) 校正室の湿度
校正室の湿度は、50 % ±20 %を維持することが望ましい。

8. 校正方法及び方法の妥当性確認

8. 1 校正方法

以下の方法を適切に組み合わせて、校正対象機器の校正を行うこと。また校正手順書は申請範囲を全て網羅し、具体的かつ詳細に記載すること。

なお、校正方法が準拠する規格は、最新の規格を用いることが原則であるが、何らかの理由でそれが不適切又は不可能であり、最新でない規格に準拠する校正方法を用いる場合は、校正手順書で明確に識別すること。またその場合、校正依頼の受付の際は顧客に対して校正方法を明確に示し、顧客要求事

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

項を満たすことができるかどうかを確認することが必要である。

(参考)本指針第9版の発行日時点では、IEC 61094-2:2009/AMD1:2022に準拠するのに相応の期間を要することが見込まれている。

1) IEC 61094-2に準拠した、相互校正法を用いた標準マイクロホンの音圧絶対校正法
2) IEC 61094-5に準拠した、計測用マイクロホンの音圧比較校正法
3) IEC TS 61094-7に記載された自由音場補正量を用いた、標準マイクロホンの自由音場感度レベルの算出
4) IEC 61094-8に準拠した、計測マイクロホンの自由音場比較校正法
5) IEC 61094-6に準拠した計測マイクロホンの周波数レスポンスの校正
6) JIS C 1509-2の該当する試験方法に準拠したサウンドレベルメータの校正
7) JIS C 1509-3の該当する試験方法に準拠したサウンドレベルメータの校正
8) 参照標準等を用いた音響校正器の音圧レベルの測定、もしくは、音響校正器を用いた校正対象機器の校正

8．2 妥当性の確認

校正方法の妥当性の確認について、文書化し記録すること。

8．3 規格外の方法

校正事業者は、8．1に記載した校正方法によらない方法で校正を行う場合には、あらかじめその実施方法を文書化し校正方法の妥当性確認を行うこと。また校正方法について校正証明書に必要な記述を付し、その場合の不確かさを算出し記載すること。

9．校正測定能力及び測定の不確かさ

9．1 校正測定能力

校正測定能力の定義は、「JCSS登録及び認定の一般要求事項」を参照のこと。

9．2 測定の不確かさ

GUM及び対応するJIS又はIEC規格を参考にして不確かさの算出を行うことを原則とする。不確かさの算出根拠を明確にすること。特に校正方法として8．1 1)を用いる場合には、国家標準へのトレービリティが確保されるよう適切に不確かさの評価を行うこと。

(参考)例えば、計測用マイクロホンの校正における不確かさの主な要因を次に示す。

1) 参照標準の感度レベル
2) 信号電圧測定
3) カプラ補正量
4) バイアス電圧
5) 温度、湿度、静圧などの環境条件
6) 自由音場補正量
7) 測定音場の乱れ

10．サンプリング

特になし

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

11. 校正品目の取り扱い

特になし

12. 結果の報告(校正証明書)

1) 校正結果は、周波数ごとに示す。計測用マイクロホンの校正結果を音圧感度レベル又は自由音場感度レベルで示したときには、その基準値を明記する。同様に音響校正器の音圧レベルについても基準値を明記する。
2) 校正環境条件として、校正時の温度、湿度、静圧を記載する。また校正結果が校正環境条件下における値であるか，又は基準環境条件下での値であることを明記する。
3) 計測用マイクロホンの校正時にバイアス電圧を加えた場合には、バイアス電圧の値を明記する。
4) 計測用マイクロホンの校正において、音響校正器またはカプラで求めた音圧感度レベルに自由音場感度レベルへの補正量(製造メーカ等提供値も含む)を用いた場合は、その旨を明記する。
5) 計測用マイクロホンの校正において、静電アクチュエータで求めた周波数レスポンスに補正量(製造メーカ等提供値も含む)を用いた場合は、その旨を明記する。
6) サウンドレベルメータについては、音響信号を用いた校正時の音圧レベルを明記する。
7) サウンドレベルメータの校正において、IEC 62585による補正量(製造メーカ等提供値も含む)を用いた場合は、その旨を明記する。
8) 音響校正器については、校正に用いた参照標準等の型式及び器物番号、並びに特定二次標準器、常用参照標準又はワーキングスタンダードの別を明記する。また参照標準等装着時の音圧レベルであるか、又は基準負荷容積付加時の音圧レベルであることを明記する。
   ① 基準負荷容積付加時の音圧レベルの場合、基準負荷容積の値を明記する。
   ② 基準負荷容積付加時の音圧レベルへの補正に関する不確かさ評価を行っていない場合には、参照標準等の実効負荷容積並びに音響校正器のカプラ容積の公称値を用いて音圧レベルを換算している旨及び補正値を明記する。
9) 必要に応じて、校正手法を記載する。
10) 不確かさは、信頼の水準約95 %となる包含係数(k)を付記した拡張不確かさ(単位：dB)で記載する。
11) 不確かさは、周波数ごとに算出するが、校正範囲を区切って不確かさを記載するときには各範囲内における不確かさのうち最も大きな値を記載する。

13. 要員

13. 1 技術に係る管理要員(代理人を含む)

1) 音響測定器等の校正事業について1人以上の技術管理者又は、技術管理者を補助する技術担当者等で構成される技術に係る管理要員を持つこと。
2) 技術に係る管理要員は、当該校正事業に関する十分な技術的知識及び経験を有し、校正結果の正確な評価を行う能力を有すること。
3) 技術に係る管理要員は、校正従事者に適切な監督及び指示を行う能力を有すること。
4) 技術管理者は、音響測定器等の校正事業に係る2年以上の経験を有することが望ましい。

13. 2 校正従事者に対する資格、経験及び教育・訓練

1) 校正従事者は、音響測定器等の校正事業に係る十分な知識と6ヵ月以上の経験を有することが望ましい。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

（参考）経験年数は、目安の期間である。実施した校正件数や持回り比較による技術能力も考慮される。

2) 校正事業者は、継続して適切な校正が実施できるよう、また最新の技術に対応できるように校正従事者に対して定期的かつ計画的に教育・訓練を行っていること。

14. サービス及び供給品の購買

校正の品質に影響する物品の購入先、校正サービス等の外部依頼先の要件を規定し記録すること。

15. 登録申請書の記載事項

申請書及び申請書別紙の記載事項の例を別添1に示す。

16. その他

特になし。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

別添1 登録申請書の記載例

登録申請書

年　月　日

独立行政法人製品評価技術基盤機構　殿

住 所 東京都〇〇区〇〇△丁目〇番△号
名 称 株式会社 △△△
代表取締役社長 ×××

計量法第143条第1項の登録を受けたいので、同項の規定により、次のとおり申請します。

1. 登録を受けようとする第90条第1項の区分並びに第90条の2の告示で定める区分並びに計量器等の種類、校正範囲及び校正測定能力

音響・超音波(詳細は別紙のとおり)

2. 計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地

名 称:株式会社 △△△ ×××工場
所在地:〇〇県〇〇市〇〇町△△番地××号

3. 計量法関係手数料令別表第1第12号の適用の有無

なし

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

別　紙（例1: 計測用マイクロホン）

登録に係る区分:音響・超音波
恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称:音響測定器等
校正測定能力

種類	校正範囲	拡張不確かさ （信頼の水準約95 %）
計測用マイクロホン （音圧感度レベル、Ⅰ形標準マイクロホン）	20 Hz以上　〇〇　Hz以下	〇〇　dB
	〇〇　Hz超　〇〇　Hz以下	〇〇　dB
	〇〇　Hz超　12.5 kHz以下	〇〇　dB
計測用マイクロホン （自由音場感度レベル、Ⅱ形計測用マイクロホン）	20 Hz以上　〇〇　Hz以下	〇〇　dB
	〇〇　Hz超　〇〇　Hz以上	〇〇　dB
	〇〇　Hz超　20 kHz以下	〇〇　dB

（解説）この例は、計測用マイクロホンの音圧感度レベル並びに自由音場感度レベルの校正を行う場合で、校正範囲を複数の範囲に区分して拡張不確かさを設定する場合である。

（注）校正範囲を複数の範囲に区分して拡張不確かさを設定するとき、隣接する区分の周波数の間隔は1/3オクターブとする。
種類の欄には音圧感度レベル又は自由音場感度レベルの別、並びに必要に応じて標準マイクロホン又は計測用マイクロホンの別、及びⅠ形又はⅡ形の別を記載する。

別　紙（例2: サウンドレベルメータ）

登録に係る区分:音響・超音波
恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称:音響測定器等
校正測定能力

種類	校正範囲	拡張不確かさ （信頼の水準約95 %）
サウンドレベルメータ （自由音場レスポンスレベル、A特性）	20 Hz	〇〇　dB
	31.5 Hz	〇〇　dB
	40 Hz	〇〇　dB
	〇〇　Hz	〇〇　dB
	〇〇　Hz	〇〇　dB
	〇〇　Hz	〇〇　dB
	12.5 kHz	〇〇　dB

（解説）この例は、サウンドレベルメータの自由音場レスポンスレベルの校正を行う場合で、1/3オクターブごとに拡張不確かさを設定する場合を示す。

（注）種類の欄には必要に応じて周波数重み付け特性を記載する。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

別　紙（例3: 音響校正器）

登録に係る区分:音響・超音波
恒久的施設で行う校正
校正手法の区分の呼称:音響測定器等
校正測定能力

種類	校正範囲			拡張不確かさ （信頼の水準約95 %）
音響校正器 （音圧レベル、Ⅰ形マイクロホン）	標準マイクロホン装着時	114 dB	250 Hz	○○ dB
	基準負荷容積付加時			○○ dB
	標準マイクロホン装着時	94 dB	1000 Hz	○○ dB
	基準負荷容積付加時			○○ dB

（解説）この例は、音響校正器の音圧レベルの校正を行う場合で、周波数ごとに拡張不確かさを設定する場合を示す。

（注）種類の欄には必要に応じてマイクロホンのⅠ形又はⅡ形の別を記載する。校正範囲の欄には必要に応じて標準マイクロホン装着時の音圧レベル又は基準負荷容積付加時の音圧レベルの別、及び公称音圧レベルの値を記載する。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

別添2 校正用機器のトレーサビリティ事例

「校正用機器のトレーサビリティ事例(音響測定器等:計測用マイクロホン)」

この事例集は、音響測定器等(計測用マイクロホン)の技術的要求事項適用指針の6．測定のトレーサビリティと校正用機器の項中6．2校正用機器の項を補足するものである。

6．2校正用機器の項では、校正結果の不確かさ又は有効性に重大な影響を持つ校正用機器は、「IAJapan計量トレーサビリティに関する方針」(URP23)に定める方針に従うことと規定されているが、必要な場合、「校正結果の不確かさ又は有効性に重大な影響を持つ校正用機器」を明確にし、及び又は、現実的にトレーサビリティの確保が困難な校正用機器を校正する場合の考え方を補足するための事例を示す。

---

1) 直流電圧計、実効値電圧計又はFFTアナライザなどの電圧読み取り装置

一般的な校正方法において、電圧読み取り装置は校正結果の不確かさに重大な影響があるので、JCSS登録事業者又は認定に関する国際機関又は地域機関の多角的承認取決(MRA: Multilateral Recognition Arrangement)に署名した認定機関の認定を受けた校正事業者(以下これらを、登録事業者等という。)により定期的に校正されていること。ただし、標準電圧発生器を用いて電圧読み取り装置を独自に校正する場合には、標準電圧発生器が登録事業者等により定期的に校正され、電圧読み取り装置を適切な精度で校正する手順、不確かさの評価、校正周期等を文書化し、校正記録等を保存すること。

2) その他

校正用計測器の校正周期は、最長1年とすることが望ましい。校正周期は、測定器の仕様、要求性能、仕様履歴等を十分に把握し実態に即して設定すること。

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。

今回の改正のポイント

・組織改編に伴う名称の変更
・その他エディトリアルな修正

（変更点には下線が付してあります。）

以上

このファイルを複写したファイルや、このファイルから印刷した紙媒体は非管理文書です。